Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/645,412	HON ET AL.
Examiner	Art Unit
Patricia Leith	1654

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
updated	all	6/9/2005	PL		
	·				
			_		

INTERFERENCE SEARCHED				
Subclass	Date	Examiner		
·				

(INCLUDING SEARC	HSTRATEGY	<u>()</u>
	DATE	EXMR
updated all	6/9/2005	PL
•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·		
	·	
•		